

证书号第 17238225 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种适用于光薄片 XRF 测试的装置

发 明 人：宋利强;葛天助;南青民;高卿楠;原春雨

专 利 号：ZL 2021 2 3361571.2

专利申请日：2021 年 12 月 28 日

专 利 权 人：自然资源实物地质资料中心

地 址：100089 北京市海淀区东升双泉堡 125 号

授权公告日：2022 年 08 月 23 日

授权公告号：CN 217277983 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

